



中华人民共和国国家标准

GB/T 17551—1998
idt ISO/IEC 11693:1994

识别卡 光记忆卡 一般特性

Identification cards—Optical memory cards—
General characteristics

1998-11-05 发布

1999-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

前言	I
ISO/IEC 前言	II
引言	III
1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义	1
4 结构	3
5 尺寸	3
6 物理特性	3
7 可访问光区域的大小和位置	4
8 光属性和特性	4
9 逻辑数据结构	4

前 言

本标准等同采用国际标准 ISO/IEC 11693:1994《识别卡 光记忆卡 一般特性》。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所归口。

本标准起草单位：电子工业部标准化研究所。

本标准主要起草人：冯敬、冯惠、李韵琴、蔡怀忠、陈云峰。

ISO/IEC 前言

ISO(国际标准化组织)和 IEC(国际电工委员会)建立了世界范围标准化的专门系统。ISO 或 IEC 的国家成员团体通过国际组织建立的各个技术委员会参与制定针对特定技术领域的国际标准。ISO 和 IEC 技术委员会在共同感兴趣的领域合作。其他与 ISO 和 IEC 有联系的官方和非官方的各国际组织也参与此项工作。

在信息技术领域,ISO 和 IEC 建立了一个联合技术委员会,即 ISO/IEC JTC1。由联合技术委员会提出的国际标准草案,需分发给各成员团体进行表决。作为国际标准的发布至少需要 75% 的成员团体投票赞成。

国际标准 ISO/IEC 11693 由联合技术委员会 ISO/IEC JTC1“信息技术”的分委员会 SC17“识别卡及相关设备”制定。

引 言

本标准是描述光记忆卡的参数以及如何使用这些卡存储和交换数字数据的一系列标准之一。

这些标准承认用于记录和读取光记忆卡上的信息存在各种不同方法,光记忆卡的特性对所采用的记录方式来说是明确的。一般而言,这些不同的记录方法不能相互兼容。因此,以一种一致的方式制定这些标准来包容现有的和将来的记录方法。

本标准是光记忆卡的通用标准,适用于某种特定记录方法的特性将出现在一些独立的标准文件中,这些文件定义了符合、加入和/或不符合此相关的基本文件的范围。

中华人民共和国国家标准

识别卡 光记忆卡 一般特性

GB/T 17551—1998
idt ISO/IEC 11693:1994

Identification cards—Optical memory cards— General characteristics

1 范围

本标准规定了在卡上存储数据、从卡上读取数据,以及在信息处理系统中光记忆卡的物理、光学和数据交换能力所必需的信息。

本标准定义了光记忆卡的一般特性,包括卡的材料、结构、特性、尺寸和测试环境,这些特性已经被确定为适用于所有类型的光记忆卡且与所使用的记录方法无关。

本标准的意图是为对在光记忆卡上编码的数字信息交换感兴趣的卡制造商、发卡者和卡用户提供必要的信息。

本标准可作为计划开发使用光记忆卡的设备和系统的厂商和用户的指南。卡的数据内容及其使用依赖于每个工业组织开发的应用。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14916—1994 识别卡 物理特性(idt ISO 7810:1985)

GB/T 16649.1—1996 识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性(idt ISO 7816-1:1987)

GB/T 17554—1998 识别卡 测试方法(idt ISO/IEC 10373:1993)

3 定义

本标准采用下列定义:

3.1 可访问的光区域 accessible optical area

可以由所用光系统的读和/或写光束进行访问的光记忆卡的任何部分。

3.2 背景反射率 background reflectivity

以特定波长通过位于相邻光迹导轨中间的透明层所测得的可访问光区域的未写、未格式化部分的反射率。

3.3 背景透射率 background transmissivity

以特定波长穿过卡的有效写和/或读位置所测得的可访问光区域的未写、未格式化部分的透射率。

3.4 光束直径 beam diameter

光层表面上测得的激光束直径的 $1/e^2$ 。

3.5 双折射 birefringence

使不同偏振的入射光波通过材料产生不同的折射波的一种材料属性。在双折射材料中,折射率是各